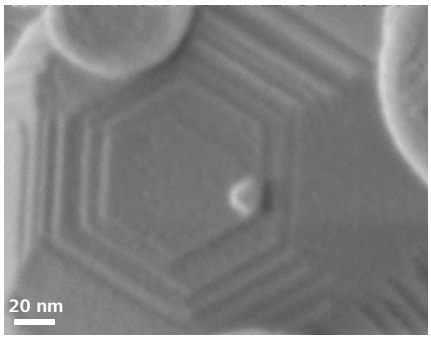
キャンペーン
2026年9月末
受注分まで

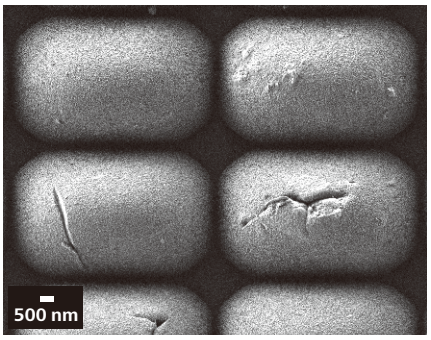
ZEISS Gemini 技術をより多くのSEMユーザーに！

高画質イメージングと高度な解析を実現する電界放出型SEM

ZEISS Sigma Family



アルミナ粒子のステップ観察、加速電圧：500 V
サンプルバイアス無し加速電圧 500 V にて 3 nm のテラス構造が観察可能、Inlens SE 像



CCD レンズの最表面観察、加速電圧：300 V
サンプルバイアス無し加速電圧 300 V にてレンズ表面の微小凹凸を観察可能、ET-SE 像

1 kV以下で強みを発揮

優れた解像度と最適なコントラスト

イメージングと解析性能の鍵となるのは電子光学カラムです。ZEISS Gemini 1 電子光学系を搭載した Sigma は、特に低加速電圧において、あらゆる試料に対して優れた分解能を発揮します。低加速電圧での分解能は、Sigma 360 で 1.1 nm @1 kV、Sigma 560 では 1.0 nm @ 1 kV, 1.5 nm @ 500 V を実現しています。

直感的なイメージングワークフロー

セットアップからAIによる結果取得まで

初心者でも専門知識に基づいたデータ取得が可能です。使いやすく覚えやすいワークフローにより、ナビゲーションから後処理までの各ステップが効率化されます。機械学習による画像セグメンテーションが可能な AI Toolkit や、スムーズなマルチモーダル実験を可能にする Connect Toolkit など、各種オプション機能により、解析のスループットが向上します。

困難な条件でもVPイメージングを実現

解析・イメージング用 NanoVP liteモード

ZEISS 独自の低真空モード NanoVP lite と新しい検出器が、5 kV 以下においても非導電性試料からの高品質データの取得を可能にします。
5 つの環状セグメントを持つ aBSD 検出器や次世代 C2D（カスケード電流検出器）などの新しい検出器を使用することで、低加速電圧でも優れたイメージングが可能です。

ZEISS Sigma 360

Sigma 360 ショットキー電界放出型走査電子顕微鏡
インレンズ二次電子検出器、ET検出器、カラーCCDチャンバースコープ
（仕様の詳細は弊社担当者にお問い合わせください。）

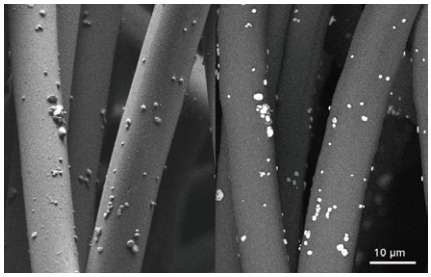
キャンペーン価格（税抜）33,000,000 円〜

ZEISS

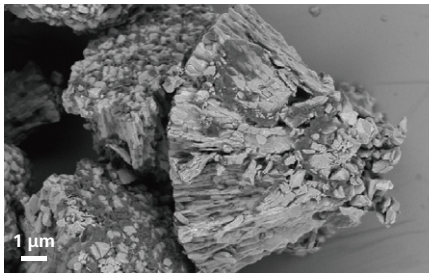
Seeing beyond

多様な試料で優れたイメージングを可能にするZEISS Gemini技術

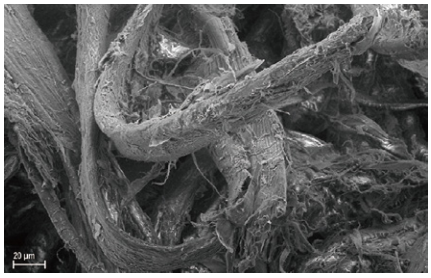
ZEISSのGemini 1 カラムは Sigma の性能の鍵で、優れた分解能、高い検出効率、最高の操作性を提供します。Gemini 対物レンズの設計は、静電場と磁場を組み合わせることで、試料に与える磁場の影響を最小限に抑えながら、光学性能を最大限に高めます。Gemini 1 カラムの高度な特長（電子光学設計、Inlens 検出、ビームブースター）は、Sigma Family に共通するものです。



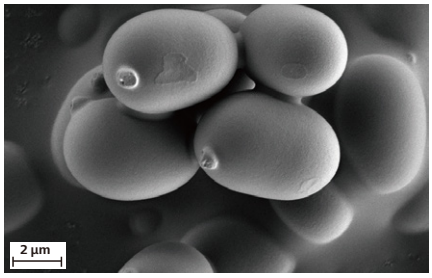
銀ナノ粒子付着ファイバー、加速電圧：1 kV
（左）Inlens Duo SE（右）Inlens Duo BSE



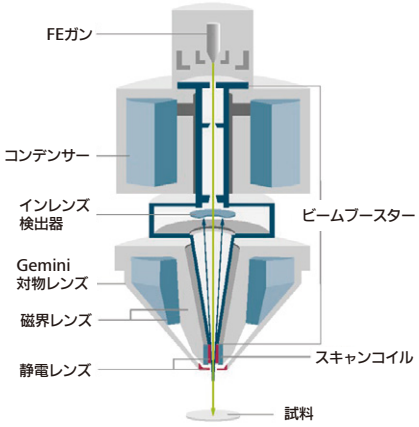
LIB 正極材 NMC 粒子のバインダー観察、加速電圧：2 kV、aBSD 像（反射電子）

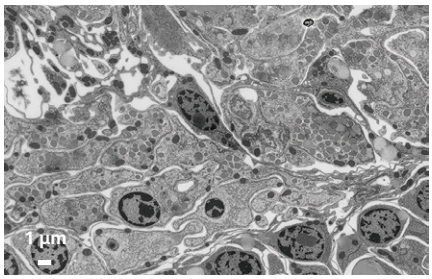


セルロースナノファイバー、加速電圧：8 kV、チャンバ真空度 40 Pa、C2D 像（無コーティング）



キノコの胞子、加速電圧：1 kV（高真空）





海産無脊椎動物の微細構造、加速電圧：1 kV、Sense BSD 像
ご提供：*Anna Seybold and Harald Hausen, Sars Centre for Marine Molecular Biology, University of Bergen, Norway*

フレキシブルな拡張性でエントリー機から最先端アプリケーションまで対応

標準の Inlens SE、ETSE 検出器に加えて、各種反射電子検出器や STEM、CL 検出器などのイメージング用検出器、EDS、EBSD、WDS 検出器を搭載可能です。また、共焦点ラマンイメージングとの組み合わせ（RISE）や加熱・引張の in situ 実験、シリアルブロックフェース（SBF）イメージングといった高度なイメージングシステムへと拡張することも可能です。

ZEISS Sigma 360

分解能 *	@ 30 kV (STEM)	1.0 nm
	@ 15 kV /DCV**	0.9 nm / 0.7 nm
	@ 1 kV /DCV**	1.3 nm / 1.1 nm
加速電圧		0.02 – 30 kV
倍　　率		10x – 1,000,000x
プローブ電流		3 pA – 20 nA（100 nA: オプション）

* 最適作動距離：設置時の検収試験において、1 kV および 15 kV で分解能の実証を実施（高真空、DCV なし）
** デコンボリューション使用時の分解能

製品の詳細情報はこちら！

カールツァイス株式会社
ZEISS Research Microscopy Solutions
info.microscopy.jp@zeiss.com

Seeing beyond

商品のデザイン、仕様、外観、キャンペーン価格は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください（記載内容：2025 年 6 月現在）。最新の情報は、弊社営業担当もしくは各販売代理店にご確認ください。
本システムの転売は禁止します。システム名、製品名は各開発会社の登録商標または商標です。本製作物の文章・画像等の内容の無断転載及び複製等の行為は禁止します。JP_20250602 Printed in Japan